

# Ux-1000W 波长色散X荧光光谱仪 华高

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | Ux-1000W 波长色散X荧光光谱仪 华高     |
| 公司名称 | 惠州市华高仪器设备有限公司              |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 | 品牌:华高<br>型号:Ux-1000W       |
| 公司地址 | 惠州市江北惠州大道9号                |
| 联系电话 | 86-07527168848 18675228366 |

## 产品详情

### ux-1000w 波长色散x荧光光谱仪

#### 产品说明

ux-1000w小型多道x射线荧光光谱仪可配置si、al、fe、ca、mg、s、k、na、cl-九通道，预留1个可增加通道位置，同时分析10种元素。标准配置na、mg、al、si、p、s、cl、k、ca、fe十种元素及氧化物的分析，是大中型企业质量控制的理想选择。

#### 针对需求满足的解决方案

建筑材料/水泥

耐火材料/陶瓷

冶金矿产/采矿

金属材料

学术研究、教学

玻璃、石墨

土壤调查/元素分析

工艺控制

成分质量控制

成分检测

检验设备

成分指令控制

产品特点

- 1.1分钟即可完成准确测试，换样抽真空时间小于15秒
- 2.下照式x射线检测，彻底避免样品破碎造成的仪器故障，提高使用效率
- 3.采用高精度流气密度稳定器(专利技术)
- 4.标准配置na、mg、al、si、p、s、cl、k、ca、fe十种元素及氧化物的分析
- 5.引入先进测试系统技术、测试的短期和长期稳定性极好
- 6.配备经验系数法、理论影响系数法、基本参数法等定量分析方法
- 7.测试精度远优于gb/t176-2008对重现性的要求，轻松满足行业需求

产品功能

具有远程诊断功能说明:我们软件集成了常用的dcs系统的通讯协议，如tcp/ip，opc，modbus，rs232/485等，可与工厂的配料系统的控制中心或plc进行数据交换，即可向配料系统传送分析数据，也可传送配比数据。实现在线数据分析、在线质量监控。

具有专利技术的，快速，安全，性能可靠而实用的样品装卸系统

摇臂式设计的样品装卸系统，完善的粉末保护方式，预真空室和限定位置机构，实现高度重现性，永久无故障，快速稳定。1000w光路设计示意图，

wdxf色散方法是建立在x射线波动性基础上，依据布拉格定律 ( $2d\sin \theta = n\lambda$ ) 对样品发射出的特征x射线及原级谱线的散射线进行分光，再将待测元素的特征x射线与基体中某些元素的高次线射入探测器并将光信号转换为电信号，经放大后，再通过模数转换 (adc) 将电信号转换为数字信号，然后由脉冲高度分析器筛除高次线、晶体荧光等，通过数据处理将特征x射线强度转换为浓度。

ux-1000w连续72小时检测ca:ka谱线的强度，达到 $q < 1.1$ ，si:ka谱线的强度，达到 $q < 1.05$ ，其他谱线轻易就可达到 $q < 1.02$ ，

1000w具有良好的稳定周期：采用了一系列先进的自动控制算法，使恒温控制、油温控制、流气密度稳定控制(专利)、高压电源控制达到了新的层次，从而使仪器的测试稳定性得以大幅度提高，接近理

论极限。对于应用行业，cao含量和sio2含量的精度是非常重要的。ux-1000w连续72小时检测ca:ka谱线的强度，达到 $q < 1.1$ ，si:ka谱线的强度，达到 $q < 1.05$ ，其他谱线轻易就可达到 $q < 1.02$ ，荧光强度的稳定性(包括短期稳定性和长期稳定性)极其卓越。使仪器的校验周期延长到每周一次。加上采用进口瓦里安x光管(76um,400w薄皮窗)和进口高压电源(60kv, 10ma)，使产品的稳定性达到行业领先水平。

1000w仪器采用wdxanalyzer v1专用工作站，人机对话的软件界面、模块化的操作按钮，不同权限的操作员凭密码登陆、输出报告可选多种模式等特点。

## 性能指标

典型白生料样品的实测分析精度(60s)，高于gb/t176-2008对重现性的要求。

| 氧化物                     | si <sub>2</sub> | al <sub>2</sub> o <sub>3</sub> | fe <sub>2</sub> o <sub>3</sub> | cao   | mgo   | na <sub>2</sub> o | k <sub>2</sub> o | so <sub>3</sub> | cl <sup>-</sup> |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 分析谱线                    | si:ka           | al:ka                          | fe:ka                          | ca:ka | mg:ka | na:ka             | k:ka             | s:ka            | cl:ka           |
| n-1                     | 0.03            | 0.02                           | 0.01                           | 0.035 | 0.02  | 0.02              | 0.01             | 0.01            | 0.000           |
| 重现性(%)                  | 0.1             | 0.06                           | 0.05                           | 0.15  | 0.05  | 0.05              | 0.05             | 0.05            | 0.002           |
| gb/t176-2008 对重现性的要求(%) | 0.2             | 0.2                            | 0.15                           | 0.25  | 0.15  | 0.05              | 0.15             | 0.15            | 0.003           |